

株式会社 RWS グループ

PatBase Analytics V3

本社住所	東京都千代田区神田三崎町 3-1-16 神保町北東急ビル4F
URL	https://www.rws.com/jp/
問い合わせ先	担当部署 営業部 TEL 03-4563-5900 FAX 03-6332-9010 E-mail sales.jp.ip@rws.com

PatBase Analytics V3は、言語・コンテンツマネジメント、知的財産サービスを提供する世界的リーディングカンパニーであるRWS Groupと特許ソフトウェア開発会社 minesoft により開発された分析ツールです。

- ★特許検索データベース PatBase の膨大なデータを即座に分析
- ★分析と検索・表示がシームレスに連携しており、検索だけでは見つけれなかった重要文献の詳細確認も可能
- ★母集団件数の上限無し（一部分析項目を除く）
- ★最大4つの分析集合を比較分析することが可能
- ★出願人、発明者の名寄せ、国&分類コードのグルーピングでチャートを最適化
- ★分析結果やグラフ、チャートは非ユーザーの方への多様な共有方法を搭載
⇒競合、市場動向調査や特許戦略の社内レポートの作成にも最適

※ PatBase Analytics V3のご利用には PatBase のご契約が必要です。

機能詳細

データ	解析対象	日本/米/欧州/PCT/中/韓/独/仏/台湾/露/伯 他 100 超の国に対応 *PatBase の収録国に準ずる				
	入力方法	特許検索データベース PatBase との連携 / 出願・公報番号・PatBase ファミリー番号				
	処理可能最大案件数	上限なし	特徴	一部分析項目を除く		
タの編集機能	検索（絞込み）機能	可	特徴	年×出願人 等分析項目での絞り込みが可能		
	データの追加・修正・削除	可	特徴	最大4つの分析集合の比較分析が可能		
	その他の編集機能	可	特徴	名寄せ・グルーピング機能、データの出力、絞込んだ集合の再分析が可能		
解析項目	出願人	解析可	上限	無	上限値	なし 備考
	発明者	解析可	上限	無	上限値	なし 備考
	IPC	解析可	上限	無	上限値	なし 備考
	FI	解析不可	上限	無	上限値	なし 備考 F タームは分析可
	CPC	解析可	上限	無	上限値	なし 備考
	技術用語	解析可	上限	無	上限値	なし 備考
	その他項目・項目の任意追加	発行国、年、代理人、リーガルステータス、引用、キーワード、コンセプト				
特許文庫・参考文献サポート	有	特徴	詳細確認可能（PatBase との連携含む）			
引用文献サポート	有	特徴	引用ネットワーク、詳細確認可能（PatBase との連携含む）			
特許価値評価機能	無	特徴	搭載予定あり（開発進行中）			
AI 活用サービス	無	特徴				
帳票出力	市販ソフトの作図機能	利用不可	特徴			
	独自の作図機能の特徴					
データ出力	CSV 出力	可	特徴			
	解析結果データの互換性	有	特徴	Excel, XML, CSV, TSV, HTML, JSON, PDF		
	用語切り出し&索引化機能	有	特徴	キーワードやコンセプトの抽出可能		
その他の機能	分析結果やグラフ、チャートは非ユーザーの方への多様な共有方法を搭載					
他のシステムとの連携	検索・DB システム	可	種類	特許検索データベース PatBase と連携		
		その他・特記事項等				
	分析ツール	可	種類	SnapShot（簡易分析機能）		
		その他・特記事項等				

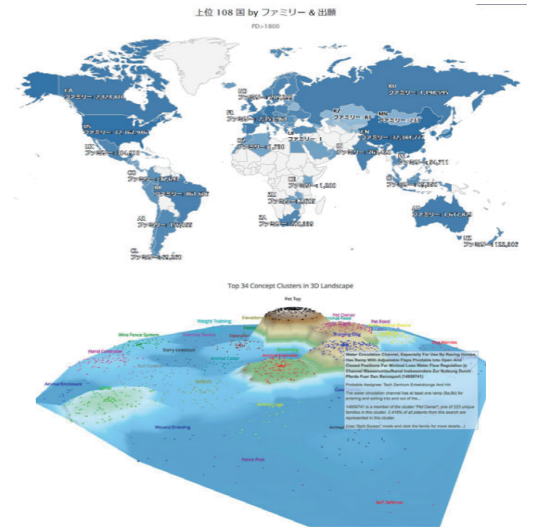
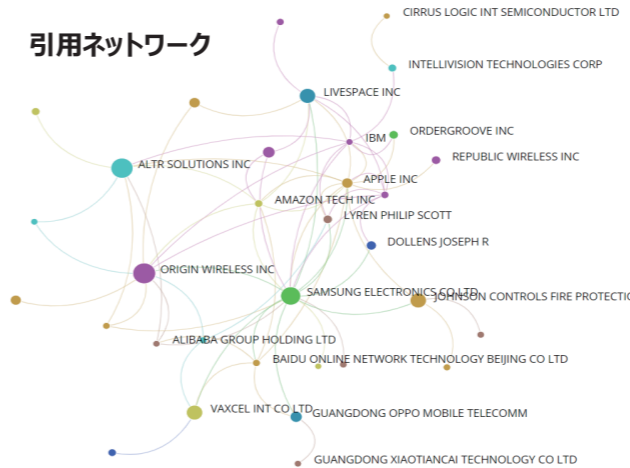
PatBase analytics v3

競合、市場動向調査や特許戦略等の社内レポート作成に最適！

- ◆膨大なデータを即座に分析
- ◆多様なグラフやチャートで表現
- ◆分析項目やグラフの詳細をカスタマイズ
- ◆PatBase非ユーザーの方にもデータを共有可能



引用ネットワーク



同僚やクライアントと共有できるレポートを自動で作成します。レポートはPDF、Word、またはPowerPointファイルとしてエクスポートすることができます。



導入用情報

動作環境	OS	
	その他	Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox
	関連ソフト	
サポート体制	ヘルプデスク(日本人スタッフ)/メールマガジン/マニュアル類/講習会/ユーザーサイト	
費用	導入費	営業担当へお問合せください
	ランニングコスト	営業担当へお問合せください
	その他	営業担当へお問合せください
その他・特記事項等	*PatBase Analytics V3 は特許検索データベース PatBase に含まれる機能です。導入には PatBase のご契約が必要です。	